سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:
بررسی توپوگرافی سطح نانو ساختار نیترید مس – نقره تهیه شده به روش لایه نشانی مغناطیسی DC

محل انتشار:
اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:
مژگان کاکایی - *گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران*

سحر رضایی - *گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران*

خلاصه مقاله:
در این مقاله توپوگرافی سطح لایه های نازک نانو کامپوزیت مس – نقره را که به روش لایه نشانی مغناطیسیDC لایه نشانی شده است، بررسی می کنیم. تصاویر سطح نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) در مد غیر تماسی ثبت شده است. در روش مورد استفاده، سطح نمونه ها را به متیف هائی با درهها یا قله هائی مشخص و یا متیف هائی با اشکال نامنظم تقسیم بندی می کنیم و با استفاده از پارامترهایآماری مربوطه به مطالعه مورفولوژی سطح می پردازیم طیف XRD حاصل از نمونه ها بر تشکیل ساختارآمورف دلالت دارد.

کلمات کلیدی:
نانو ذرات مس- نقره، AFM, EDX

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://civilica.com/doc/434644